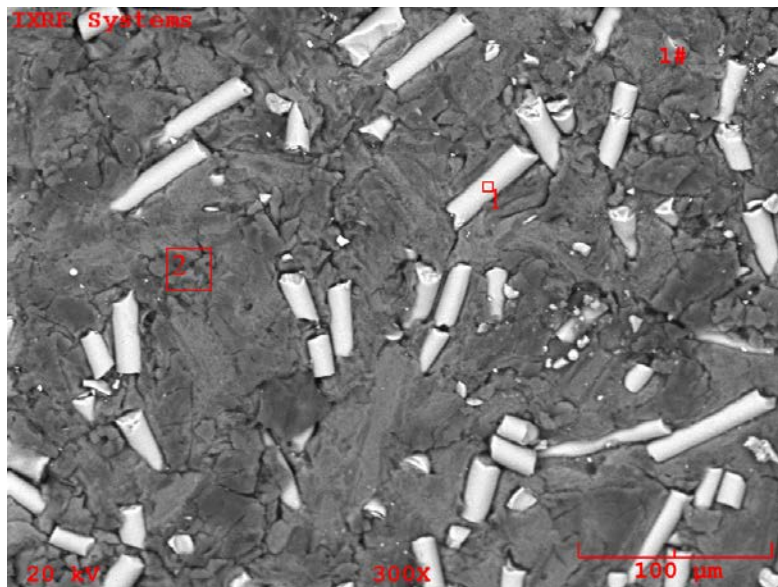


IXRF 能谱观测聚四氟乙烯混料

摘要：IXRF 能谱与日立钨灯丝结合，观测聚四氟乙烯混料样品，得到不同区域的元素分布差异

观察用电镜：日立 SU3500

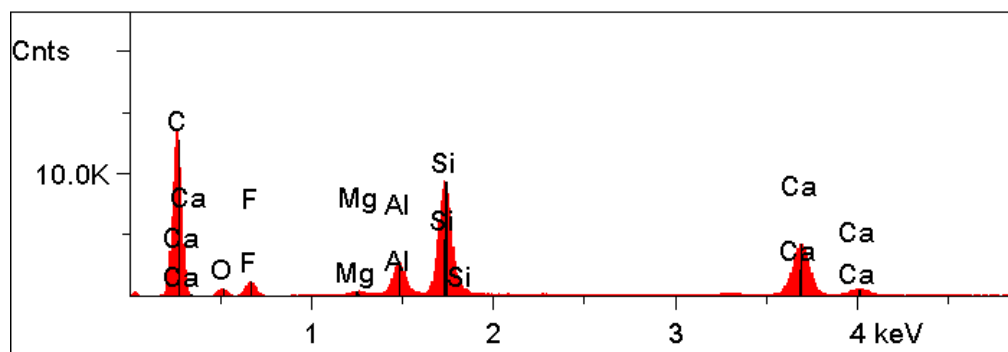
能谱：IXRF SDD 2610，10mm² 晶体有效面积，126eV 分辨率



电镜图像：

在图像上选两个点做能谱分析

1#点谱图



天美（中国）科学仪器有限公司
TECHCOMP (CHINA) LTD.

中国北京朝阳区天畅园 7 号楼 1、3 层
TEL:010-64010651
FAX:010-64060202
E-MAIL:techcomp@techcomp.cn

Application

半定量结果

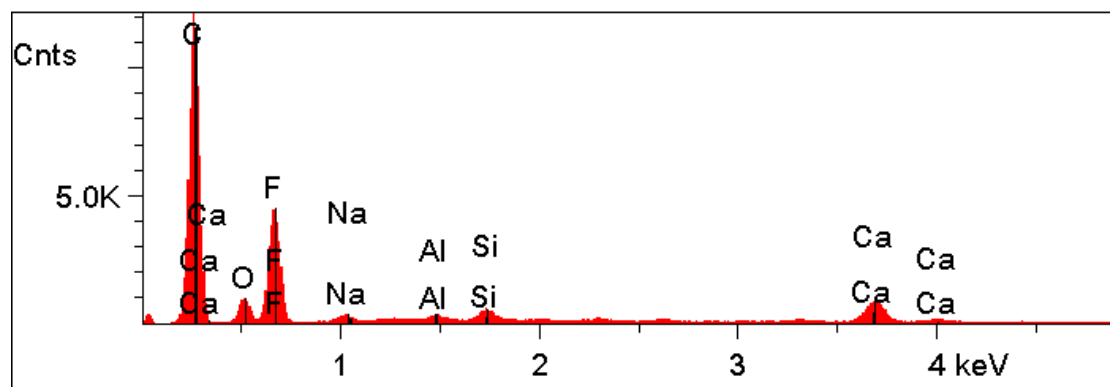
Elt.	Line	Intensity (c/s)	Conc	Units	
C	Ka	525.67	56.32	wt.%	
O	Ka	36.23	6.76	wt.%	
F	Ka	81.20	7.44	wt.%	
Mg	Ka	24.20	.47	wt.%	
Al	Ka	225.09	3.92	wt.%	
Si	Ka	825.33	14.03	wt.%	
K	Ka	13.00	.26	wt.%	
Ca	Ka	487.89	10.80	wt.%	
			100.00	wt.%	Total

kV 20.0

Takeoff Angle 35.0°

Elapsed Livetime 100.0

2#点谱图



天美（中国）科学仪器有限公司
TECHCOMP (CHINA) LTD.

中国北京朝阳区天畅园 7 号楼 1、3 层
TEL:010-64010651
FAX:010-64060202
E-MAIL:techcomp@techcomp.cn

Application

半定量结果

Elt.	Line	Intensity (c/s)	Conc	Units	
C	Ka	485.38	45.65	wt.%	
O	Ka	65.13	12.01	wt.%	
F	Ka	302.04	35.78	wt.%	
Na	Ka	21.60	1.29	wt.%	
Al	Ka	18.60	.65	wt.%	
Si	Ka	39.62	1.21	wt.%	
Ca	Ka	96.83	3.41	wt.%	
			100.00	wt.%	Total

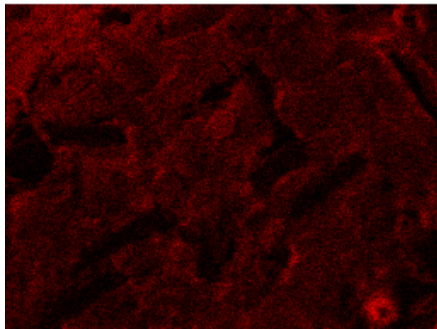
kV 20.0

Takeoff Angle 35.0°

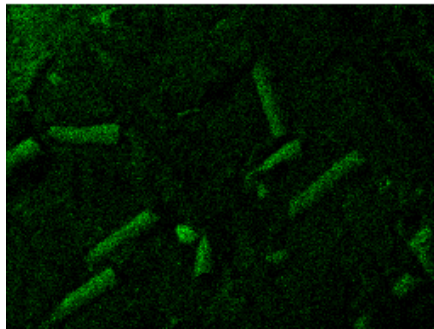
Elapsed Livetime 100.0

面分布结果

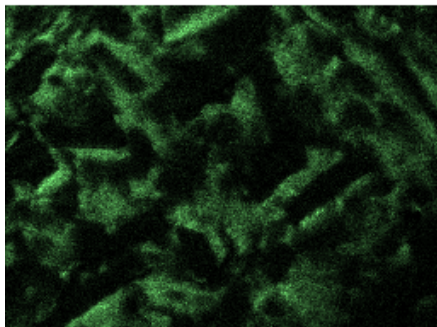
C



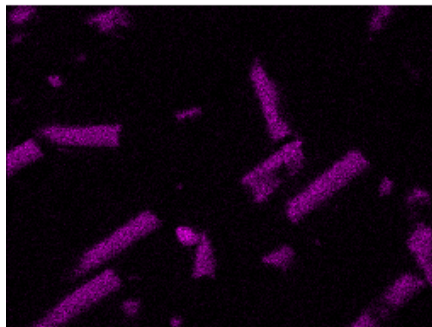
O



F



Si





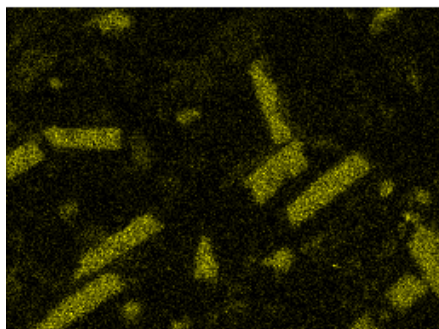
天美

天美（中国）科学仪器有限公司
TECHCOMP (CHINA) LTD.

中国北京朝阳区天畅园 7 号楼 1、3 层
TEL:010-64010651
FAX:010-64060202
E-MAIL:techcomp@techcomp.cn

Application

Ca



Al

